

PG101 WIS晶圓級光電元件檢測設備



PG101WIS是整合手動探針台以及光譜儀系統用於分析光學材料之設備,其應用於LED, PD, Vcsel, Laser diode等。
PG101WIS是您研發及應用的高性價比設備

光譜儀規格

項目	檔位範圍	準確度
峰值波長	380~780nm	±0.5nm
主波長	380~780nm	±0.5nm
光通量	1lm~250.000lm	±4%
	repeatability	±0.2%
色溫	1000K~10.000K	Follow (x,y)
色座標	CIE 1931 (x,y)	±0.003
	repeatability	±0.2%
色溫	CCT	Follow (x,y)
	1.000~100.000K	
半高寬	0~200nm	±0.5nm
純度	100%	±5%
演色性	0-100%	±3%

特色

- 緊湊的外觀尺寸
- 輕巧外型
- 光電合一應用
- 光強度及波長量測
- 應用於LED/Vcsel/LD/PD量測
- 標準四寸晶圓量測(可客製化)

探針台規格

- 四寸鎳合金真空平台
- 真空溝槽可以不同尺寸設計
- 樣品尺寸5mm*5mm-4 inch
- 標準四組探針座
- X-Y chuck 10um移動解析度

選配

- 平台θ角度可調
- 加熱平台25-150度±1℃
- 高壓探頭選配
- 低電流/電容探頭
- 待測物夾具
- 電路板夾具
- 防震桌
- 真空幫浦
- 屏蔽機櫃

